

Výpočet vf cívky na základě změřeného vzorku

Zadávané parametry:

Počet zkušebních závitů –

Změřená indukčnost – (μH),

Požadovaná indukčnost – (μH).

1) Kontrola programu – **LRN**

2) Vložit do paměťových registrů údaje:

Počet zkušebních závitů – **STO 1**

Změřená indukčnost vzorku (μH) –
STO 2

Požadovaná indukčnost (μH) – **STO 3**

3) **RST – R/S**

Po ukončení výpočtu se na displeji objeví počet závitů pro požadovanou indukčnost.

4) Vyvolání **výsledků**:

Počet závitů pro požadovanou indukčnost (μH) – **RCL 4**

Konstanta K měřeného jádra – **RCL 5**

00	33	1	RCL 1	07	33	3	RCL 3
01	45	=		08	24	\sqrt{x}	
02	33	2	RCL 2	09	39	4	PRD 4
03	24	\sqrt{x}		10	33	4	RCL 4
04	85	=		11	81	R/S	
05	32	4	STO 4	12	71	RST	
06	32	5	STO 5				

Karel Dušek